



Title of Change:	5-inch Production line closure of ON Semiconductor Niigata Co., Ltd. (OSNC)													
Proposed first ship date:	18 January 2019													
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Yukio.Kudo@onsemi.com><Katsumi.Yamamoto@onsemi.com>													
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.													
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Satoru.Fujinuma@onsemi.com>.													
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>													
Change Part Identification:	Date Code													
Change Category:	☒ Wafer Fab Change ☐ Assembly Change ☐ Test Change ☐ Other _____													
Change Sub-Category(s):	☐ Manufacturing Site Addition ☐ Material Change ☐ Datasheet/Product Doc change ☐ Manufacturing Site Transfer ☐ Product specific change ☐ Shipping/Packaging/Marking ☒ Manufacturing Process Change ☐ Other: _____													
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Niigata, Japan	External Foundry/Subcon Sites: None												
Description and Purpose: This final notification announces the elimination of Hydrazine in ON Semiconductor Niigata Co., Ltd. (OSNC) Japan for parts listed in this PCN. The related products are transferred to a process that does not use Hydrazine on the same site OSNC. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Change Point</th> <th>Before Change Description</th> <th>After Change Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fab (OSNC)</td> <td>N1 Fab (Minimum rule=0.8um, Class=10)</td> <td>N1 Fab (Minimum rule=0.8um, Class=10) AND N2 Fab (Minimum rule=0.25um, Class=1)</td> </tr> <tr> <td>Equipment</td> <td>5inch equipment</td> <td>6inch equipment (Each function is the same)</td> </tr> <tr> <td>Si Sub material</td> <td>5inch wafer</td> <td>6inch wafer (No change except wafer diameter)</td> </tr> </tbody> </table>			Change Point	Before Change Description	After Change Description	Fab (OSNC)	N1 Fab (Minimum rule=0.8um, Class=10)	N1 Fab (Minimum rule=0.8um, Class=10) AND N2 Fab (Minimum rule=0.25um, Class=1)	Equipment	5inch equipment	6inch equipment (Each function is the same)	Si Sub material	5inch wafer	6inch wafer (No change except wafer diameter)
Change Point	Before Change Description	After Change Description												
Fab (OSNC)	N1 Fab (Minimum rule=0.8um, Class=10)	N1 Fab (Minimum rule=0.8um, Class=10) AND N2 Fab (Minimum rule=0.25um, Class=1)												
Equipment	5inch equipment	6inch equipment (Each function is the same)												
Si Sub material	5inch wafer	6inch wafer (No change except wafer diameter)												

**Reliability Data Summary:**

QV DEVICE NAME : LV5696P-E

PACKAGE : HZIP15J

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Tj=150°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc	0/77
THB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias	1008 hrs	0/77
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/77
HBM	JS001	100pF, 1.5kohm, V=+/-2KV	-	0/3
CDM	JS002	V=+/-500V	-	0/3

Note:

Judgment Criteria: Judgment Criteria are due to the limits of the electrical characteristics in the detail specification.

Electrical Characteristic Summary:

There is no change in the electrical performance. Datasheet specifications remain unchanged.

List of Affected Parts:

Part Number	Qualification Vehicle
LV8139JA-AH	LV5696P-E
LV8405V-TLM-E	LV5696P-E

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号: FPCN22135X

発行日: 11 October 2018

変更件名:	オン・セミコンダクター新潟株式会社 (OSNC) の 5-インチ生産ラインの閉鎖	
初回出荷予定日:	18 January 2019	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Yukio.Kudo@onsemi.com><Katsumi.Yamamoto@onsemi.com> にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、今回の変更の初回通知、初回 PCN、または最終 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。	
その他の信頼性データ:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Satoru.Fujinuma@onsemi.com> にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> をお願いします。	
変更部品の識別:	日付コード	
変更カテゴリ:	☒ ウェハファブの変更 ☐ アセンブリの変更 ☐ 試験の変更 ☐ その他 _____	
変更サブカテゴリ:	☐ 製造拠点の追加 ☐ 製造拠点の移転 ☒ 製造プロセスの変更 ☐ 材料の変更 ☐ 製品仕様の変更 ☐ データシート/製品資料の変更 ☐ 出荷/パッケージング/表記 ☐ その他: _____	
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: オン新潟 (日本)	外部製造工場 / 下請け業者拠点: なし
説明および目的: 本最終通知は、オン・セミコンダクター新潟株式会社において本 PCN に記載された製品におけるヒドラジンの使用中止を通知するものです。 関連する製品は、同じ OSNC のヒドラジンを使用しないプロセスに移管されます。		
変更点	変更前の表記	変更後の表記
製造 (OSNC)	N1 製造 (最小ルール=0.8um、クラス=10)	N1 製造 (最小ルール=0.8um、クラス=10) および N2 製造 (最小ルール=0.25um、クラス=1)
装置	5 インチ装置	6 インチ装置 (それぞれの機能は同じ)
Si サブマテリアル	5 インチ ウェハ	6 インチ ウェハ (ウェハ径以外に変更なし)



信頼性データの要約:

QV 素子名: LV5696P-E

パッケージ: HZIP15J

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Tj=150°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs	0/77
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/77
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to +150°C	500 cyc	0/77
THB	JESD22-A101	85°C, 85% RH, bias	1008 hrs	0/77
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/77
HBM	JS001	100pF, 1.5kohm, V=+/-2KV	-	0/3
CDM	JS002	V=+/-500V	-	0/3

注:

判定基準: 判定基準は、詳細仕様での電気的特性の制限によります。

電気的特性の要約:

電気的性能に変更はありません。データシート仕様に変更はありません。

影響を受ける部品の一覧:

部品番号	品質試験用ピークル
LV8139JA-AH	LV5696P-E
LV8405V-TLM-E	LV5696P-E